La giunzione MeSC: tipologie

Il comportamento della giunzione può essere ohnico o raddrizzante dipendentemente dalla differenza tra il lavoro di estrazione del Metallo e del SC usati:

- SC-N, $E_{WM} > E_{WS}$: giunzione raddrizzante
- SC-N, $E_{WM} < E_{WS}$: giunzione ohmica
- SC-P, $E_{WM} > E_{WS}$: giunzione ohmica
- SC-P\, $E_{WM} < E_{WS}$: giunzione raddrizzante

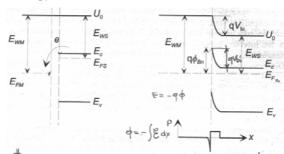
A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

1/13

Dispositivi Elettronici – La giunzione Metallo-Semiconduttore

La giunzione MeSC ti tipo N raddrizzante: $E_{WM} > E_{WS}$

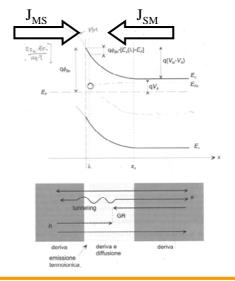
- Al contatto gli elettroni (maggioritari) nel semiconduttore passano nel metallo, dove il livello di Fermi è inferiore
- All'equilibrio il SC presenta un maggiore svuotamento
- Gli elettroni nel Me sono confinati da una barriera: $q\phi_{Bn}=E_{WM}-q\chi$, dove χ è l'affinità elettronica
- Nel SC la barriera è: $q\phi_{bi} = E_{WM} E_{WS}$



A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

La giunzione MeSC ti tipo N raddrizzante: $E_{WM} > E_{WS}$

- All'equilibrio si creano due flussi di corrente di portatori maggioritari (elettroni): J_{SM}, J_{MS}
- J_{SM}, J_{MS} sono di natura emissione termoionica in prossimità della giunzione, ma lontano da questa diventano di driva-diffusione



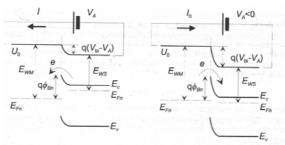
A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

2/12

Dispositivi Elettronici – La giunzione Metallo-Semiconduttore

La giunzione MeSC ti tipo N raddrizzante: $E_{WM} > E_{WS}$

- Polarizzando direttamente:
 - ${}^{\blacksquare}La$ barriera SC-Me si riduce e $J_{SM}>>J_{SM0}$
 - $^{\blacksquare}$ La corrente termoionica J_{MS} resta inalterata perché non varia la barriera di potenziale, quindi $J_{MS0}=J_{MS}$
- Polarizzando inversamente:
 - ullet L'unica corrente è ${\rm J}_{\rm SM0}$ che è debole, si ha quindi la corrente inversa



A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

La giunzione MeSC ti tipo N raddrizzante: $E_{WM} > E_{WS}$

- Si può dimostrare che la corrente è formalmente identica a quella della giunzione PN: $I = I_0 \left[\exp \left(\frac{V_A}{\eta V_T} \right) 1 \right]$
- Con fattore di idealità η prossimo ad 1, mentre la corrente di saturazione inversa è (A* cost. di Richardson):

$$I_0 \approx A^* T^2 \exp\left(-q\phi_b / k_B T\right)$$

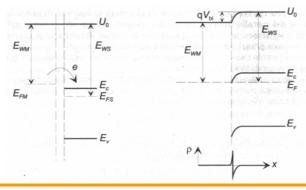
A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

5/12

Dispositivi Elettronici – La giunzione Metallo-Semiconduttore

La giunzione MeSC ti tipo N ohmica: $E_{WM} > E_{WS}$

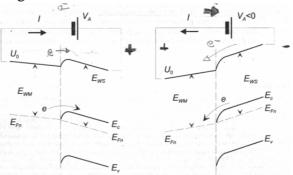
- Al contatto gli elettroni del Me passano nel SC, questo si carica negativamente di portatori maggioritari che diffondono con lunghezze molto piccole (Lunghezza di Debye)
- \blacksquare Il potenziale di built-in regola i flussi $J_{MS0}=J_{SM0}$ all'equilibrio



A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

La giunzione MeSC ti tipo N ohmica: $E_{WM} > E_{WS}$

- \blacksquare Un presenza di una pol. Diretta la barriera si abbassa consentendo un maggior flusso di cariche dal Me verso il SC: J_{MS}
- Un presenza di una pol. Inversa la barriera si alza consentendo un maggior flusso di cariche dal SC verso il Me: J_{SM}
- Questo tipo di giunzione è non-raddrizzante



A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

7/12

Dispositivi Elettronici – La giunzione Metallo-Semiconduttore

La giunzione PN con contatti metallici

- Se supponiamo di connettere una giunzione PN con un metallo alle due estremità si ha che, se il lato p da luogo ad un contatto ohmico, necessariamente dal lato n si ha una giunzione raddrizzante:
- Le condizioni sono:

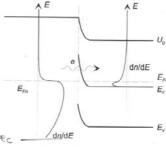


• Queste condizioni non sono verificabili

A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

La giunzione Me $SC-N^{++}$ ti tipo ohmico

- Per risolvere il problema si introduce la giunzione Me SC <u>fortemente</u> <u>drogato N</u>
- I lavori di estrazione sono nella condizione analoga a quella di una giunzione raddrizzante: $E_{WS}^N < E_{WM}^N$
- Essendo l'estensione della regione svuotata inversamente proporzionale al livello di drogaggio $\propto \sqrt{N_D}$, può essere perforata per effetto tunnel



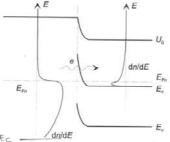
A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

9/12

Dispositivi Elettronici – La giunzione Metallo-Semiconduttore

La giunzione Me SC-N++ ti tipo ohmico

- Per risolvere il problema si introduce la giunzione Me SC <u>fortemente</u> <u>drogato N</u>
- \blacksquare I lavori di estrazione sono nella condizione analoga a quella di una giunzione raddrizzante: $E_{WS}^N < E_{WM}^N$
- Essendo l'estensione della regione svuotata inversamente proporzionale al livello di drogaggio $\propto \sqrt{N_D}$, può essere perforata per effetto tunnel



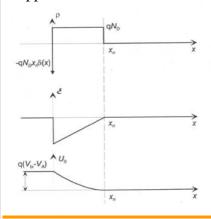
A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

Dispositivi Elettronici – La giunzione Metallo-Semiconduttore La giunzione Me SC-N⁺⁺ ti tipo ohmico • Questa giunzione ci permette di realizzare i contatti ohmici per tutti i E_{FSn} dispositivi elettronici E_{FM} E E_{FM} A lato il diagramma a bande di un diodo PN con metallo U₀ sem. p sem. n relativi contatti ohmici E_{WSn} E_F 11/12 A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

Dispositivi Elettronici – La giunzione Metallo-Semiconduttore

Capacità della giunzione Schottky

- Non essendoci portatori in eccesso in diffusione, la capacità è pari a quella di giunzione.
- In modo del tutto analogo a quanto fatto per la giunzione PN applicando i risultati dell'elettrostatica alla distribuzione di carica:



Si trova

$$Q_{j} = qx_{n}N_{D} = A\sqrt{2q\varepsilon N_{D}(V_{bi} - V_{A})}$$

$$C_{j} = \left| \frac{dQ_{j}}{dV_{A}} \right| = A \sqrt{\frac{q \varepsilon N_{D}}{2(V_{bi} - V_{A})}}$$

Che è identica a quella della giunzione PN con N_A>>N_D

A. A. 07-08 - Università degli Studi di Firenze, Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica